リフトオフに依存しない PEC 減肉評価方法の検討

三浦かさね *1	前角 貴弘 *	2 大森 征一*1
Miura Kasane	Maezumi Takahiro	Oomori Seiichi
水上 孝一*3	藤原 貢*	4 田中 孝治*5
Mizukami Koichi	Fujiwara Mitsugu	Tanaka Koji

近年、プラント配管等の減肉検査方法として、パルス渦電流探傷 (PEC) が注目されている。現在よく用いられる超音波検査法では、保温材等の除去や接触媒質の使用が必要であるが、PEC では非接触による探傷が可能ため、このような作業が不要である。しかし、PEC では、リフトオフによる測定値の変化が一つの課題とされている。当社では、これまでに愛媛大学との共同研究により開発したプローブで、模擬試験片を用いた PEC 減肉測定試験を報告している⁽¹⁾。本稿では、それらの試験結果を基に、リフトオフに依存しない PEC 減肉評価方法を検討した。

キーワード:パルス渦電流探傷、PEC、減肉検査、リフトオフ、減肉評価方法

1. はじめに

発電設備・化学プラント等おける配管の減肉現 象は、運用・管理における重要な一つの問題であ る。そのため、配管外面における保温材の下の腐 食や⁽²⁾、配管内面における流れ加速腐食⁽³⁾等に起 因する減肉や破損の防止には、定期的な検査が必 要である。一般に配管減肉の検査には、超音波検 査法やX線検査法が用いられているが、超音波検 査法には外装板金と保温材を外す工程や、接触媒 質の塗布や除去の必要性から、検査時間およびコ ストに課題がある⁽⁴⁾。また、X線検査法は、放射線 管理上の難しさから適用範囲が限られる。これら に対して、PEC は非接触検査が可能かつ放射線管 理が不要なため、今後の有力な配管減肉検査手法 として注目されている。

しかし一方で、PEC による減肉測定では、リフ トオフによる測定値の変化が課題とされている。 そのため、これまでに、リフトオフの影響を受け ない配管肉厚との相関パラメータ⁽⁴⁾が検討・報告 されている。

本稿では、PECを用いた減肉測定における、リ フトオフ補正を必要としない評価方法の検討結果 を紹介する。

2. PEC による減肉検出原理

PEC では、励磁コイルに低周波数のパルス電流 を流すと、減衰が小さい渦電流が生じ、表面より も深い部分まで浸透する。図1に示すように、渦 電流の浸透可能な範囲に裏面がある場合は、裏面

*1:検査事業部 技術部 NDE グループ

*4:検査事業部 技師長

^{*2:}元検査事業部 技術部 NDE グループ (現株式会社 IHI 技術開発本部 技術基盤センター 生産プロセスグループ) *3:国立大学法人愛媛大学 理工学研究科 生産環境工学専攻 機械工学講座 講師 博士(工学)

^{*5:}検査事業部 技術部 部長



図1 PEC を用いた減肉検出概念図

に達した渦電流は急激に減衰し、その減衰時間は 図1のBに示すように、板厚が大きいほど長くな る。減肉部の残厚は、渦電流の減衰過程を検出コ イルに生じる電圧の減衰時間として観測すること により、測定することができる。

3. 試験方法

試験方法は、3.1節~3.4節に示す試験条件を設 定し、試験片の模擬減肉部の板厚 t=2mm (t2)、 3mm(t3)、4mm(t4)、5mm(t5) における検出電圧の 経時変化を求めた。

3.1 使用機器

使用した機器を**図2**に示す。また、機器の構成 および試験手順を以下に示す。

矩形パルス波はファンクションジェネレータで 生成し、パワーアンプで増幅してプローブの励磁 コイルへ出力した。励磁コイルによる電磁誘導で 試験片表面に渦電流が生じると、周囲の磁場変化 により、検出コイルには検出電圧が生じる。検出 電圧はプリアンプで増幅し、ローパスフィルタと USB オシロスコープを通して PC に表示した。

3.2 試験片

本試験では、図3に示す SS400 階段状減肉模擬 試験片の模擬減肉部の板厚 t2、t3、t4、t5 につい て測定した。試験片寸法は、縦300mm×横600mm、 健全部の板厚は6mm である。各模擬減肉部を模 擬した寸法は、縦150mm×横150mm である。

3.3 測定条件

本試験は、以下の条件で実施した。

- (1) 励磁周波数:10Hz
- (2) 励磁電圧:±530mV × 20 倍增幅
- (3) 検出電圧増幅率:50 倍
- (4) ローパスフィルタ: 100kHz



図2 使用機器



- (5) 測定範囲: 20mV
- (6) 測定開始: 矩形パルス波形の立下りから 100µs後(図4)

リフトオフの再現にはアクリル板を使用し、各 板厚におけるリフトオフ 0mm(Lif.0)、5mm(Lif.5)、 10mm(Lif.10)のデータを取得した。

3.4 信号処理

信号処理には、移動平均(一定時間で区切られ



た各区間の平均値を、各区間の最終時間にプロットしたもの)と加算平均(20回測定の平均値をプロットしたもの)を用いた。

リフトオフに依存しない PEC 減肉評価方法の 検討

図5に板厚t2、t3、t4、t5における検出電圧の 減衰を示す。検出電圧20mV以下における減衰す る時間は、リフトオフにより多少異なるが、全体 的に板厚が小さいほど早い傾向が見られた。減衰 する時間への影響は、図5に示すように、リフト オフよりも板厚による違いの方が大きいことがわ かる。しかし、板厚ごとにリフトオフによる減衰 の差が見られるため、検出電圧のしきい値による 次の3つのパターンで整理した。

- (1) しきい値到達時間
- (2) しきい値到達時間差
- (3) 検出電圧の積分値



_ 5 _

4.1 しきい値到達時間による評価方法

しきい値到達時間による評価は、いずれかのし きい値により、各板厚でリフトオフに関係なく識 別可能と予想した。検出電圧のしきい値が5mV、
 10mV、19mVの場合のしきい値到達時間とリフト
 オフの関係を図6~図8に示す。図6より、しき



い値 5mV の t4 Lif.5 と t5 Lif.0 では、しきい値到達 時間にほとんど差が見られなかった。図7より、 しきい値 10mV の t4 Lif.5 と t5 Lif.0、t5 Lif.10 では、 しきい値到達時間にほとんど差が見られなかっ た。図8より、しきい値 19mV の t3 Lif.5 と t4 Lif.0、 t4 Lif.10、t5 Lif.0、t5 Lif.10 は、しきい値到達時間 にほとんど差が見られなかった。

リフトオフによるしきい値到達時間のばらつき は、異なる板厚で重複し、明確に分離できなかった。

4.2 しきい値到達時間差による評価方法

図9に、しきい値到達時間差による評価方法を 示す。検出電圧に2つのしきい値を設け、しきい 値1を5mV、しきい値2を19mVとし、検出電圧 の変化をしきい値到達時間の差分で評価した。

図 10 に、板厚 t2、t3、t4、t5 におけるしきい値 到達時間差とリフトオフの関係を示す。t2 Lif.5 と t3 Lif.0、t3 Lif.10 は、しきい値到達時間差にほと んど差がなく、リフトオフによるしきい値到達時 間差のばらつきは、異なる板厚で重複し、明確に 分離できなかった。

4.3 検出電圧の積分値による評価方法

図11に示す検出電圧の減衰変化の積分値による 評価方法では、検出電圧のしきい値1を5mV、し きい値2を19mVとし、検出電圧の減衰過程の変 化を時間の差分ではなく面積の差分として評価し た。図12に、板厚t2、t3、t4、t5における積分値







図 10 しきい値到達時間差とリフトオフの関係(しきい値 1:5mV、しきい値 2:19mV)



図 12 積分値とリフトオフの関係(しきい値1:5mV、しきい値2:19mV)

とリフトオフの関係を示す。リフトオフによる積 分値のばらつきは、異なる板厚で重複せず明確に 分離できた。また、図13に各リフトオフにおける 積分値と板厚の関係を示す。リフトオフを変化さ せても、積分値と板厚に比例関係が成り立ち、積 分値は減肉評価のパラメータとなると考えられる。



図 13 積分値と板厚の関係(しきい値1:5mV、しきい値2:19mV)

5. まとめ

リフトオフに依存しない PEC 減肉評価方法と して3つの方法を検討した結果、リフトオフによ るばらつきが最も小さい評価方法は、積分値によ る評価方法であった。本検討では、各板厚におけ る積分値を求めることにより、リフトオフに依存 しない減肉評価が可能であることが示唆された。

今後は、板厚の適用範囲およびリフトオフの限 界距離について、具体的に調べて積分値による評 価方法の適用対象を広げる。なお、本検討内容に ついては、現在特許出願中である。

参考文献

- 前角貴弘、北園夏未、大森真実、水上孝一、 佐々木孝明:パルス渦流探傷試験(PEC法)を 用いた減肉検査の基礎検討、IIC REVIEW、 No.64、2020/04、pp.8-12
- (2) 川野浩二:配管保温材下腐食(CUI)診断技術
 と評価、検査技術、Vol.13、No.3、2008、pp.25-30
- (3) 椿崎仙市、高田政治ほか:火力プラント水処 理における脱ヒドラジンへの取組み、三菱重 工技報、Vol.46、No.2、2009
- (4)程衛英、古村一朗:パルス渦電流試験法によ る減厚評価のシミュレーション解析、溶接・ 非破壊検査技術センター技術レビュー、 Vol.7、2011、pp.18-24

検査事業部	元検査事業部 技術部
技術部 NDE グループ	NDE クルーク(現株式会社 IRI 技術開発本部 技術基盤センター 生産プロセスグループ)
三浦 かさね	前角 貴弘
TEL. 045-791-3523 FAX. 045-791-3547	TEL. 045-791-3523 FAX. 045-791-3547
検査事業部 技術部 NDE グループ	国立大学法人愛媛大学 理工学研究科 生産環境工学専攻 機械工学講座 講師 博士 (工学)
大森 征一	水上 孝一
TEL. 045-791-3523 FAX. 045-791-3547	TEL. 089-927-9729 FAX. 089-927-9729
検査事業部 技師長 藤原 貢	検査事業部 技術部 部長
TEL. 045-791-3523	田中 孝治
FAX. 045-791-3547	TEL. 045-791-3523 FAX. 045-791-3547